ENT AND TRADEMARK OFFICE IN THE UNITED STATE

IN RE APPLICATION OF: Hiroyuki OKUWAKI, et al.

GAU:

2881

SERIAL NO: 09/731,793

EXAMINER:

FILED: FOR:

December 08, 2000

METHOD AND DEVICE FOR ADJUSTING A MULTI-BEAM SOURCE UNIT, METHOD FOR

ASSEMBLING THE MULTI-BEAM SOURCE UNIT, AND IMAGE FORMING APPARATUS USING THE

MULTI-BEAM SOURCE UNIT

REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS WASHINGTON, D.C. 20231

01	rn	
	ıк	

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number [US App No], filed [US App Dt], is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

COUNTRY

APPLICATION NUMBER

MONTH/DAY/YEAR

JAPAN

11-349145

December 8, 1999

JAPAN

2000-206535

July 7, 2000

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- are submitted herewith
- will be submitted prior to payment of the Final Fee
- were filed in prior application Serial No. filed
- $\ \square$ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number . Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
 - (B) Application Serial No.(s)
 - are submitted herewith
 - will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak

24,913 Registration No.

Joseph A. Scafetta, Jr. Registration No. 26,803

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220

(OSMMN 10/98)

09/131,193



日本国特許庁 PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年12月 8日

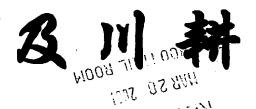
出 願 番 号 Application Number:

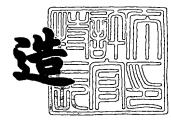
平成11年特許願第349145号

株式会社リコー

2000年10月27日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





出証番号 出証特2000-3089282

特平11-349145

【書類名】

特許願

【整理番号】

9908553

【提出日】

平成11年12月 8日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B41J 2/44

G02B 7/00

【発明の名称】

マルチビーム光源ユニットの調整方法、その調整装置、

その光源ユニットの組立方法及びそれを有する画像形成

装置

【請求項の数】

13

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】

奥脇 浩之

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】

川添 修

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】

直江 康弘

【特許出願人】

【識別番号】

000006747

【氏名又は名称】

株式会社リコー

【代理人】

【識別番号】

100082670

【弁理士】

【氏名又は名称】

西脇 民雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

007995

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9808671

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

マルチビーム光源ユニットの調整方法、その調整装置、

その光源ユニットの組立方法及びそれを有する画像形成装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 切り欠きが形成されたステムを有しかつ複数の発光点からマルチレーザビームを出射可能なマルチビームレーザダイオードと前記マルチレーザビームを平行光束に変換するコリメートレンズとを備え、前記切り欠きにより規定される仮想直線上に発光点が存在しているときに設計的に予定された設計基準直線の方向に発光点が配列されているとして走査光学系にセットされるように設計されたマルチビーム光源ユニットの調整方法であって、

前記設計基準直線に対する前記発光点の配列状態を画像記録面に対応する像面上でのビームスポットに基づき測定して、前記光学系の光軸回りに前記マルチビームレーザダイオードを回転調整することにより、前記発光点の配列方向を前記設計基準直線の方向に揃えることを特徴とするマルチビーム光源ユニットの調整方法。

【請求項2】 前記画像記録面に対応する像面上で、前記発光点のうちの最も遠く離れている二個の発光点に対応する二個のビームスポットを結んで得られる直線に基づき前記設計基準直線に対する前記発光点の配列方向を決定することを特徴とする請求項1に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法。

【請求項3】 前記画像記録面に対応する像面上で、前記各発光点に対応する ビームスポットの相対位置を測定して前記各発光点が直線上に存在しているとみ なせる近似直線を求め、前記近似直線により前記発光点の配列方向を決定するこ とを特徴とする請求項1に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法。

【請求項4】 前記近似直線を最小二乗法により求めることを特徴とする請求項3に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法。

【請求項5】 前記画像記録面に対応する像面上で、前記各発光点に対応する ビームスポットの主走査方向に対する相対位置を前記設計基準直線に対する相対 角度位置で測定して前記ビームスポット間の主走査方向の最大偏差を求め、前記 マルチビームレーザダイオードを回転させて異なる相対角度位置で前記ビームス ポットの主走査方向に対する相対位置を測定してビームスポット間の主走査方向 の最大偏差を求めることを繰り返すことにより、前記発光点の配列状態を測定し 、前記最大偏差が最も小さい相対角度位置により前記発光点の配列方向を決定す ることを特徴とする請求項1に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法。

【請求項6】 前記発光点の配列方向が副走査方向と実質的に平行となっていることを特徴とする請求項1に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法。

【請求項7】 前記マルチビーム光源ユニットは、前記マルチビームレーザダイオードを回転可能に支持しかつ回転中心を規定する嵌合筒を有するベース部材と、画像形成装置本体部の主走査方向対応基準面に突き合わされる主走査方向対応基準面と前記嵌合筒に嵌合する嵌合孔とを有して前記画像形成装置本体部に取り付けられる取り付けブラケットと、位置決め用係合部に係合する係合片と前記ステムを押圧付勢する押圧バネ片とを有して前記マルチビームレーザダイオードを前記ベース部材に押圧固定する押圧板とを備え、前記位置決め用係合部に前記係合片を係合させて、前記ベース部材に前記マルチビームレーザダイオードを位置決めした後、前記ベース部材を前記取り付けブラケットに支持させて回転させることにより、前記発光点の配列方向を副走査方向に実質的に平行に調整することを特徴とする請求項1に記載のマルチレーザビーム光源ユニットの調整方法。

【請求項8】 前記マルチビーム光源ユニットは、マルチビームレーザダイオードを支持しかつ回転中心を規定する嵌合筒と前記画像形成装置装置本体部の主走査方向対応基準面に突き合わされる主走査方向対応基準面とを有して前記画像形成装置本体部に取り付けられるベース部材と、前記位置決め用係合部に係合する係合片と前記ステムを押圧付勢する押圧バネ片とを有して前記マルチビームレーザダイオードを前記ベース部材に押圧固定する押圧板とを備え、前記位置決め用係合部に前記係合片を係合させて、前記ベース部材に前記マルチビームレーザダイオードを位置決めした後、前記マルチビームレーザダイオードを回転させることにより、前記発光点の配列方向を副走査方向に実質的に平行に調整することを特徴とする請求項1に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法。

【請求項9】 複数個の発光点を有してマルチレーザビームを出射可能なマルチビームレーザダイオードと前記マルチレーザビームをコリメートするコリメー

トレンズとを有して位置決め固定されるベース部材と、前記発光点の配列方向を ビームスポットに基づき測定して光学系の光軸回りに前記マルチビームレーザダ イオードを回転調整するために前記マルチレーザビームが投影される撮像素子と 、該撮像素子と前記コリメートレンズとの間に設けられて前記各マルチレーザビ ームを集光して前記撮像素子の撮像面にそれぞれ結像させる結像レンズとを備え 、該結像レンズの前側焦点位置が前記コリメートレンズの後側焦点位置に実質的 に一致されていることを特徴とするマルチビーム光源ユニットの調整装置。

【請求項10】 前記撮像素子がCCDカメラであり、該CCDカメラの撮像 上面上でのマルチレーザビームのビームスポットの結像面積が画素の十倍以上と なるように前記結像レンズが配置されていることを特徴とする請求項9に記載の マルチビーム光源ユニットの調整装置。

【請求項11】 各マルチレーザビームの出力が実質的に等しくなるように制御するために、N個の発光点のうちのいずれか1個の発光点のマルチレーザビームの検出出力を基準としてその各発光点の出力の総和が前記検出出力のN倍となるように各発光点の発光出力を制御する制御回路が設けられていることを特徴とする請求項9に記載のマルチビーム光源ユニットの調整装置。

【請求項12】 請求項1に記載のマルチビームレーザダイオードの発光点の 配列状態を測定する測定ステップと、

前記発光点の配列状態の測定に基づき請求項1に記載の設計基準方向に前記発 光点の配列方向が一致するように請求項1に記載のマルチビームレーザダイオー ドを回転調整する回転調整ステップと、

該マルチビームレーザダイオードの回転調整後に請求項1に記載のコリメート レンズの位置調整を行って前記マルチビームレーザダイオードに対する前記コリ メートレンズの位置決めを行う位置決めステップと、

を含むことを特徴とする請求項1に記載のマルチビーム光源ユニットの組立方 法。

【請求項13】 請求項1に記載の調整方法によって調整されたマルチビーム 光源ユニットが位置決めして取り付けられる位置決め基準部を有することを特徴 とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、デジタル複写機、レーザプリンタ等のその画像形成装置に用いられるマルチビーム光源ユニットの調整方法、その調整装置、その組立方法、それを有する画像形成装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来から、デジタル複写機、レーザプリンタ等の画像形成装置には、レーザ走 査光学装置を搭載したものが知られている。そのレーザ走査光学装置には、近時 、書き込みの高精度化、書き込みの高速化の要求に伴って、マルチビームレーザ ダイオードを用いるものが主流となりつつある。

[0003]

図1はそのレーザ走査光学装置の概略図であり、その図1において、1はマルチビーム光源ユニット、2はポリゴンミラー、3はf θ レンズ、4は感光体(画像記録媒体ともいう)である。マルチビーム光源ユニット1はマルチビームレーザダイオード5とコリメートレンズ6とから大略構成されている。マルチビームレーザダイオード5は複数の発光点からマルチレーザビームPを出射する。そのマルチレーザビームPはコリメートレンズ6によって平行光束に変換される。そのマルチレーザビームPはポリゴンミラー2によって反射されて感光体4の表面(画像記録面ともいう)4 a に導かれる。

[0004]

そのポリゴンミラー2とf θ レンズ3とは走査光学系の一部を構成し、そのマルチレーザビームPは、図2に示すように感光体4の表面4 a 上でその主走査方向Q1と直交する副走査方向Q2に所定ピッチX1を開けて主走査方向Q1に走査される。この種のレーザ走査光学装置では、感光体4の表面4 a を多数行同時に走査して感光体4の表面4 a 上に書き込みが行われる。

[0005]

そのレーザ走査光学装置には、書き込みの高精度化、書き込みの高速化に関連

して、マルチレーザビームPの感光体4の表面4 a上でのビームスポット11の 径、コリメート性、隣接するビームスポット11の副走査方向Q2のピッチX1 、主走査方向Q1の書き込み開始位置の精度の向上が要求されている。その書き 込み開始位置の精度は、画像品質の高精度化の要求のもとで益々きびしいものが 要求されつつある。

[0006]

ところで、そのマルチビームレーザダイオード5は図3に示すようにその内部 に発光部7を有する。その発光部7には複数個の発光点、例えば4個の発光点7 a ~ 7 d が設けられている。その発光点7 a ~ 7 d は本来的には設計的に予定された仮想直線Q3上に間隔を開けて配列されるものである。その仮想直線Q3は、そのマルチビームレーザダイオード5の金属製ステム8に形成されている鋭角状の一対の切り欠き9、10の先鋭点9a、10aを結ぶことによって与えられる。

[0007]

従来のこの種のマルチビームレーザダイオード5では、各発光点7a~7dの間隔が広く、感光体4の表面4a上にマルチレーザビームを投影したときにそのビームスポット11の副走査方向Q2のピッチX1が大きくなって、画像品質が粗くなるという不都合があるため、図4に示すように感光体4の表面4a上で主走査方向Q1に対してビームスポット11の配列方向(直線)Q3'が斜めになるように走査光学系(図示を略す)の光軸回りにマルチビームレーザダイオード5を回転調整することによって、副走査方向Q2のピッチX1を調整し、副走査方向Q2の書き込み密度(記録密度)を上げて画像品質の向上を図っている。

[0008]

しかしながら、ビームスポット11の配列方向(直線)Q3'が副走査方向Q2に対して斜めにずれるようにマルチビームレーザダイオード5を回転調整して、書き込み密度を向上させることとすると、同時に各発光点7a~7dを駆動して書き込みを行った場合に、感光体4の表面4a上でのビームスポット11の主走査方向Q1の書き込み開始位置がずれることになり、かえって、画像品質が劣化する。

[0009]

そこで、この種のレーザ走査光学装置では、感光体4の表面4 a 上での書き込み開始位置を各ビームスポット毎に揃えるために、例えば、各レーザビームの走査位置を検出する検出センサ12を各レーザビーム毎に対応させて配置し、各検出センサ12の受光タイミングに基づいて各発光点7a~7dの発光を制御するようにしている。

[0010]

すなわち、時刻 t = t 0 で先頭のビームスポット11を検出してから各ビームスポット11の検出時点から時間 t 0'後に各発光点7a~7dの発光制御を行うことにより、感光体4の表面4aへの主走査方向Q1の書き込み開始位置を揃えている。

[0011]

また、各発光点7a~7dに対応させて検出センサ12をそれぞれ設ける代わりに、図5(a)に示すように主走査方向Q1に最も先行するビームスポット11に対応させて検出センサ12を設けると共に、各ビームスポット11の時間的ズレt1、t2、t3をあらかじめ求め、図示を略す遅延制御回路により図5(b)に示すようにその最も先行するビームスポット11の検出センサ12による検出時点から残余の発光点7b~7dの発光をその時間的ズレに対応させて遅らせることにより、図5(a)に示すように感光体4の表面4a上での書き込み開始位置でのビームスポット11を副走査方向に揃えるようにしている。

[0012]

しかしながら、この種の走査光学装置では、書き込み開始位置を揃えるための 制御回路が複雑化し、コストアップとなるという不都合を招く。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、近時、従来に較べて発光点7a~7dの間隔が狭いマルチビームレーザダイオード5が開発されつつある。この種のマルチビームレーザダイオード5を有するマルチビーム光源ユニットは、発光点7a~7dの位置のばらつきが小さいと考えられている。この種のマルチビーム光源ユニットでは、一対の切り

欠き9、10により規定される仮想直線Q3上に発光点7a~7dが存在しているときに設計的に予定された設計基準直線の方向に発光点7a~7dが配列されているものとして走査光学系にセットされるように設計して、画像形成装置本体部にそのまま取り付けることが考えられる。

[0014]

しかしながら、それでも、このマルチビームレーザダイオード5はその製造工程上の誤差によって、発光点7a~7dが誤差なく仮想直線Q3上に乗っていることは希である。図6に示すように、発光点7a~7dを結ぶ配列方向(直線)Q4が仮りに存在するとしても、その配列方向Q4と仮想直線Q3とは僅かながら傾いており、何らの調整を必要とすることなく発光点7a~7dの配列方向を設計基準直線の方向に揃えることは困難である。なお、ここで、符号θはその傾き角度を示している。

[0015]

また、走査光学系を搭載する画像形成装置本体部にマルチビームレーザダイオード5を取り付ける場合に取り付け誤差が存在するため、副走査方向Q2に対して配列方向Q4が所定角度となるようにマルチビームレーザダイオード5を光軸回りに回転調整して取り付けることができるようにすることが望ましい。

[0016]

本発明は、上記の事情に鑑みて為されたもので、その目的とするところは、走査光学系の主走査方向に対するマルチビームレーザダイオードの発光点の配列方向を設計的に予定された設計基準直線方向に揃えることのできるマルチビーム光源ユニットの調整方法、その調整装置、その組立方法及びそれを有する画像形成装置を提供することにある。ことに、マルチビームレーザダイオードの配列方向を走査光学系の副走査方向に容易にかつ設計上の要求精度に支障を生じることなく調整することのできるマルチビーム光源ユニットの調整方法、その調整装置、その組立方法及びそれを有する画像形成装置を提供することにある。

[0017]

【課題を解決するための手段】

請求項1に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法は、切り欠きが形成さ

れたステムを有しかつ複数の発光点からマルチレーザビームを出射可能なマルチビームレーザダイオードと前記マルチビームレーザビームを平行光束に変換するコリメートレンズとを備え、前記切り欠きにより規定される仮想直線上に発光点が存在しているときに設計的に予定された設計基準直線の方向に発光点が配列されているとして走査光学系にセットされるように設計されたマルチビーム光源ユニットの調整方法であって、前記設計基準直線に対する前記発光点の配列状態を画像記録面に対応する像面上でのビームスポットに基づき測定して、光学系の光軸回りに前記マルチビームレーザダイオードを回転調整することにより、前記発光点の配列方向を前記設計基準直線の方向に揃えることを特徴とする。

[0018]

請求項1に記載の発明によれば、設計基準直線に対する発光点の配列状態を画像記録面に対応する像面上でのビームスポットに基づき測定して、光学系の光軸回りにマルチビームレーザダイオードを回転調整することにしたので、その発光点の配列方向を設計基準直線の方向に容易に揃えることができる。

[0019]

請求項2に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法は、前記画像記録面に 対応する像面上で、前記発光点のうちの最も遠く離れている二個の発光点に対応 する二個のビームスポットを結んで得られる直線に基づき前記設計基準直線に対 する前記発光点の配列方向を決定することを特徴とする。

[0020]

請求項2に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法によれば、最も離れた 発光点のみで発光点の配列方向を決定するので、マルチビームレーザダイオード の発光点の配列方向の決定を容易に行うことができる。

[0021]

請求項3に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法は、前記画像記録面に 対応する像面上で、前記各発光点に対応するビームスポットの相対位置を測定し て前記各発光点が直線上に存在しているとみなせる近似直線を求め、前記近似直 線により前記発光点の配列方向を決定することを特徴とする。

[0022]

請求項4に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法は、前記近似直線を最 小二乗法により求めることを特徴とする。

[0023]

請求項5に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法は、前記画像記録面に 対応する像面上で、前記各発光点に対応するビームスポットの主走査方向に対す る相対位置を前記設計基準直線に対する相対角度位置で測定して前記ビームスポット間の主走査方向の最大偏差を求め、前記マルチビームレーザダイオードを回 転させて異なる相対角度位置で前記ビームスポットの前記主走査方向に対する相 対位置を測定してビームスポット間の主走査方向の最大偏差を求めることを繰り 返すことにより、前記発光点の配列状態を測定し、前記最大偏差が最も小さい相 対角度位置により前記発光点の配列方向を決定することを特徴とする。

[0024]

請求項3~請求項5に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法によれば、 精度良くマルチビーム光源ユニットの配列方向を設計基準直線の方向に揃えるこ とができる。

[0025]

請求項6に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法は、前記発光点の配列 方向が副走査方向と実質的に平行となっていることを特徴とする。

[0026]

請求項6に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法によれば、各発光点の配列方向を画像形成装置本体部に取り付ける前に予め副走査方向に揃えることができるので、画像形成装置本体部にマルチビーム光源ユニットを取り付けてから副走査方向のビームスポットのピッチを調整するという調整操作、ビームスポットのピッチ調整により主走査方向にずれた書き込み開始位置を補償するために、画像形成装置本体部に各レーザビームの走査位置を検出する検出センサを各レーザビーム毎に設けて、各レーザビーム毎に書き込み開始位置を制御するという複雑な構成、各レーザビームの主走査方向の時間的遅延を測定して遅延回路によりマルチレーザビームの駆動制御を行うという複雑な構成を避けることができ、部品点数の低減、画像形成装置本体部への取り付けに要する組立時間の短縮、低コ

スト化を図ることができる。また、ソフトウエアによる制御の簡単化も図ることができる。

[0027]

請求項7に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法は、前記マルチビーム 光源ユニットは、前記マルチビームレーザダイオードを回転可能に支持しかつ回 転中心を規定する嵌合筒を有するベース部材と、画像形成装置本体部の主走査方 向対応基準面に突き合わされる主走査方向対応基準面と前記嵌合筒に嵌合する嵌 合孔とを有して前記画像形成装置本体部に取り付けられる取り付けブラケットと 、位置決め用係合部に係合する係合片と前記ステムを押圧付勢する押圧バネ片と を有して前記マルチビームレーザダイオードを前記ベース部材に押圧固定する押 圧板とを備え、前記位置決め用係合部に前記係合片を係合させて、前記ベース部 材に前記マルチビームレーザダイオードを位置決めした後、前記ベース部 材に前記マルチビームレーザダイオードを位置決めした後、前記ベース部材を前 記取り付けブラケットに支持させて回転させることにより、前記発光点の配列方 向を副走査方向に実質的に平行に調整することを特徴とする。

[0028]

請求項8に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法は、前記マルチビーム 光源ユニットは、マルチビームレーザダイオードを支持しかつ回転中心を規定する嵌合筒と前記画像形成装置装置本体部の基準面に突き合わされる基準面とを有 して前記画像形成装置本体部に取り付けられるベース部材と、前記位置決め用係 合部に係合する係合片と前記ステムを押圧付勢する押圧バネ片とを有して前記マ ルチビームレーザダイオードを前記ベース部材に押圧固定する押圧板とを備え、 前記位置決め用係合部に前記係合片を係合させて、前記ベース部材に前記マルチ ビームレーザダイオードを位置決めした後、前記マルチビームレーザダイオード を回転させることにより、前記発光点の配列方向を副走査方向に実質的に平行に 調整することを特徴とする。

[0029]

請求項7、8に記載のマルチビーム光源ユニットの調整方法によれば、マルチビーム光源ユニットを画像形成装置本体部に組み込む前に単体で調整することができるので、画像形成装置本体部への組み付け作業の簡略化を図ることができる

[0030]

請求項9に記載のマルチビーム光源ユニットの調整装置は、複数個の発光点を有してマルチレーザビームを出射可能なマルチビームレーザダイオードと前記マルチレーザビームをコリメートするコリメートレンズとを有して位置決め固定されるベース部材と、前記発光点の配列方向をビームスポットに基づき評価して走査光学系の光軸回りに前記マルチビームレーザダイオードを回転調整するために前記マルチレーザビームが投影される撮像素子と、該撮像素子と前記コリメートレンズとの間に設けられて前記各マルチレーザビームを集光して前記撮像素子の撮像面にそれぞれ結像させる結像レンズとを備え、該結像レンズの前側焦点位置が前記コリメートレンズの後側焦点位置に実質的に一致されていることを特徴とする。

[0031]

請求項9に記載のマルチビーム光源ユニットの調整装置によれば、全ての発光 点からのマルチレーザビームを拡大してかつ極力集光して実質上撮像面に集光結 像させることができるので、ビームスポットの位置を高精度に検出できる。

[0032]

請求項10に記載のマルチビーム光源ユニットの調整装置は、前記撮像素子が CCDカメラであり、該CCDカメラの撮像上面上でのマルチレーザビームのビームスポットの結像面積が画素の十倍以上となるように前記結像レンズが配置されていることを特徴とする。

[0033]

請求項10に記載のマルチビーム光源ユニットの調整装置によれば、撮像面上での分解性能を向上させることができ、精度良くビームスポットの中心位置を算出できる。

[0034]

請求項11に記載のマルチビーム光源ユニットの調整装置は、各マルチレーザビームの出力が実質的に等しくなるように制御するために、N個の発光点のうちのいずれか1個の発光点のマルチレーザビームの検出出力を基準としてその各発

光点の出力の総和が前記検出出力のN倍となるように各発光点の発光出力を制御 する制御回路が設けられていることを特徴とする。

[0035]

請求項11に記載のマルチビーム光源ユニットの調整装置によれば、各発光点の発光出力を同一とすることができるので、撮像面上でのビームスポットの大きさを同一とすることができ、精度良くビームスポットの中心位置を算出できる。

[0036]

請求項12に記載のマルチビーム光源ユニットの組立システムは、

請求項1に記載のマルチビームレーザダイオードの発光点の配列状態を測定する測定ステップと、

前記発光点の配列状態の評価に基づき請求項1に記載の設計基準方向に前記発 光点の配列方向が一致するように請求項1に記載のマルチビームレーザダイオー ドを回転調整する回転調整ステップと、

該マルチビームレーザダイオードの回転調整後に請求項1に記載のコリメート レンズの位置調整を行って前記マルチビームレーザダイオードに対する位置決め を行う位置決めステップと、

を含むことを特徴とする。

[0037]

請求項12に記載のマルチビーム光源ユニットの組立システムによれば、マルチビーム光源ユニットの組立工程において、ビームスポットの配列方向の調整とコリメートレンズの位置調整とを一緒に行うことができ、光源ユニットの組立作業の効率化を図ることができる。

[0038]

請求項13に記載の画像形成装置は、請求項1に記載の調整方法によって調整 されたマルチビーム光源ユニットが位置決めして取り付けられる位置決め基準部 を有することを特徴とする。

[0039]

請求項13に記載の画像形成装置によれば、調整済みのマルチビーム光源ユニットを画像形成装置本体部に取り付ける際に、走査光学系に対する位置調整作業

の簡略化を図ることができる。

[0040]

【発明の実施の形態】

[マルチビーム光源ユニット及びその調整方法の発明の実施の形態 1]

図7は本発明に係わるマルチビーム光源ユニット19の分解斜視図である。その図7において、20は取り付けブラケットである。この取り付けブラケット20は底壁部21と起立壁部22と側壁部23、23とを有する。その底壁部21には一対の位置決め孔21a、21aとネジ挿通孔21b、21bとが形成されている。

[0041]

その底壁部21の底面には図8に示すように位置決め基準部24が形成されている。この位置決め基準部24は主走査方向を規定する主走査方向対応基準面24aを有している。この位置決め基準部24は後述する画像形成装置本体部としてのハウジングに形成された位置決め基準部に突き合わされる。

[0042]

起立壁部22には円形貫通孔25が設けられている。その起立壁部22の背面には、図9、図10に示すように一対の位置決め基準部26、26が貫通孔25を挟んでその両側に設けられている。この位置決め基準部26、26は位置決め基準部24の主走査方向対応基準面24aに対して実質的に垂直な副走査方向対応基準面26aを有している。この一対の位置決め基準部26、26にはネジ挿通孔27、27がそれぞれ設けられている。

[0043]

起立壁部22の背面側には円形貫通孔25と同心に円形状嵌合筒28が形成され、円形状嵌合筒28と一方の位置決め基準部26との間に回動規制ピン29が 突設されている。

[0044]

その起立壁部22の背面側にはベース部材30が取り付けられる。このベース 部材30はマルチビームレーザダイオード31を保持する。このベース部材30 は図11に拡大して示すようにその正面側に円形状嵌合筒28に嵌合される円形 状嵌合筒32を有する。

[0045]

円形状嵌合筒28の内径と円形貫通孔25の孔径とは同径であり、円形貫通孔25の中心を中心にして円形状嵌合筒32が回転可能な程度に、円形状嵌合筒32の外径は円形貫通孔25の孔径よりも若干小さく形成されている。

[0046]

その円形状嵌合筒32にはコリメートレンズ33を支持する円弧状支持部34が形成されている。このコリメートレンズ33はマルチビームレーザダイオード31から出射されたマルチレーザビーム光を平行光束に変換する役割を果たし、コリメートレンズ33の円弧状支持部34への取り付けの詳細については後述する。

[0047]

その円形状嵌合筒32はその中央に開口35を有する。円形状嵌合筒32には一対の切り欠き32a、32aが開口35を挟んで形成されている。円形状嵌合筒32にはマルチレーザビームを整形するアパーチャ部材36が装着される。このアパーチャ部材36には水平方向に長く延びるスリット開口36aと一対の切り欠き32a、32aに係合する一対の係合片36b、36bとが形成されている。マルチレーザビームはこの開口35を通じてコリメートレンズ33に向けて出射される。

[0048]

そのベース部材30の両側には一対の位置決め基準部26、26に対応する箇所に一対の位置決め基準部37、37が形成されている。その位置決め基準部37、37にはネジ孔38、38がそれぞれ形成されている。その一方の位置決め基準部37と円筒状嵌合筒32との間には回動規制ピン29が遊挿される遊挿孔39が形成されている。

[0049]

そのベース部材30の背面側には図12に拡大して示すように押圧板40を取り付けるための押圧板取り付け部41が形成されている。その押圧板40はその中央に4個の押圧バネ片40aと1個の位置決め用係合片40bと一対の貫通孔

40c、40cとを有する。

[0050]

押圧板取り付け部41には開口35と同心の嵌合孔42が形成されている。この嵌合孔42にはステム31Bの取り付け基準孔42aとステム31Bの突き当て基準面42bとが形成されている。

[0051]

その取り付け基準孔42 a の孔径はステム31 B の孔径よりも若干大きく形成されると共に、取り付け基準孔42 a の深さはステム31 B を突き当て基準面42 b に押し付けたときにそのステム31 B の背面が押圧板取り付け部41 の背面から突出する程度とされている。

[0052]

この嵌合孔42にはマルチビームレーザダイオード31の円筒状本体部31Aが嵌合される。押圧板取り付け部41には嵌合孔42を挟んでその両側に、押圧板40の貫通孔40c、40cに対向してネジ孔41a、41aが形成されている。この貫通孔40c、40cの孔径は後述するスプリングワッシャ付きのネジ43の軸部より若干大径である。

[0053]

その押圧板40はマルチビームレーザダイオード31の円筒状本体部31Aを 嵌合孔42に嵌合させ、押圧バネ片40aをマルチビームレーザダイオード31 のステム31Bの背面に当てがって、ネジ43、43をネジ孔41a、41aに 螺合させることによって押圧板取り付け部41に押圧固定される。

[マルチビームレーザダイオード31の構成]

マルチビームレーザダイオード31の円筒状本体部31Aの内部には図13に示すように台座44が設けられ、この台座44には長方形状の発光チップ部(発光部)45が設けられている。この発光チップ部45にはここでは4個の発光点45a~45dが設けられている。そのステム31Bには鋭角形状の一対の切り欠き46、46が形成されている。その円筒状本体部31Aの中心O1の近傍に発光点45a~45dは位置している。

[0054]

その発光点45a~45dは本来的には一対の切り欠き46、46の先鋭点46a、46aを結ぶ仮想直線Q3上に一定間隔を開けて配列されるものであるが、マルチビームレーザダイオード31の製造上の誤差によって発光点45a~45dを結ぶ配列方向Q4はその仮想直線Q3に対して傾いている。そのステム31Bには仮想直線Q3と直交する位置に位置決め用係合部としての矩形状の切り欠き47が形成されている。

[0.055]

この切り欠き47は押圧板40の係合片40bと係合し、ベース部材30にマルチビームレーザダイオード31を固定する際の位置決め基準に用いられる。このマルチビームレーザダイオード31は図14に示すようにその切り欠き47に係合片40bを係合させることによりベース部材30に対して位置決めされて、そのベース部材30にネジ43により固定される。そのベース部材30は図15に示すようにスプリングワッシャ付きのネジ47、により起立壁部22に仮止め固定され、これによって、光源ユニット19が組み立てられる。

[マルチビーム光源ユニットの角度調整方法]

図16はそのマルチビームレーザダイオードの調整方法に用いる調整装置の模式図である。この調整装置は、集光レンズ(結像レンズ)48と撮像素子49とを有する。その調整装置は基準取り付け部50を有し、光源ユニット19はその位置決め基準部24の主走査方向対応基準面24aが基準取り付け部50の基準面に突き合わされた状態で調整装置にセットされる。

[0056]

この調整装置に光源ユニット19をセットした状態で、光硬化型接着剤(紫外線硬化型接着剤)が塗布された円弧状支持部34にコリメータレンズ33を配置する。そのコリメータレンズ33は図示を略すコリメータレンズ把持アームに把持されて円弧状支持部34上の設計上予定された初期位置に配置される。そのコリメータレンズ把持アームは3軸方向に独立制御可能な3軸移動ステージに設けられている。

[0057]

そのベース部材30の上端面でかつ回動規制ピン29が存在する部分よりも外

側位置にはマイクロメータの先端51が当てがわれる。この状態で、マルチビームレーザダイオード31の各端子31cに駆動電圧を同時に印加する。これにより、各発光点45a~45dが発光されて画像記録面4aに相当する撮像面49a上に、図17に示すように各発光点45a~45dに対応するビームスポット52~55が形成される。

[0058]

ここでは、仮想直線Q3は設計上の取り付け誤差がないとしたときに副走査方向Q2、すなわち、設計基準直線に一致している。各発光点45a~45dは製造上の誤差によってばらついており、各ビームスポット52~55の撮像面49a上での主走査方向Q1の位置、副走査方向Q2の間隔は一定ではないと考えられ、必ずしも、各ビームスポット52~55の配列状態としての配列方向Q4が存在するとは限らない。

[0059]

そこで、ここでは、発光点 $45a\sim45d$ のうちの最も遠く離れている二個の発光点45a、45dを結んで得られる(ビームスポット52、55を結んで得られる)直線を配列方向Q4とみなして、この配列方向Q4の仮想直線Q3に対する角度 θ を測定する。

[0060]

すなわち、ビームスポット52とビームスポット53との副走査方向の間隔をx2、ビームスポット52とビームスポット54との副走査方向の間隔をx3、ビームスポット52とビームスポット55との副走査方向の間隔をx4とし、ビームスポット52とビームスポット53との主走査方向の間隔をy2、ビームスポット52とビームスポット54との主走査方向の間隔をy3、ビームスポット52とビームスポット55との主走査方向の間隔をy4とすると、角度θは以下の式に基づいて求められる。

[0061]

 $\theta = t a n^{-1} (y 4 / x 4)$

この発光点45a~45dのうちの最も遠く離れている二個の発光点45a、45dを結んで得られる直線(ビームスポット52、55を結んで得られる直線

)を配列方向Q4とみなす代わりに、最小2乗法により近似直線を求めて、この 最小2乗法により得られた近似直線を配列方向Q4として用いて、配列方向Q4 の仮想直線Q3に対する角度θを求めても良い。

$$\theta = (\Sigma (x' i \times y' i) - \Sigma (x' i \times y' i) / N)$$

$$/ (\Sigma x' i^2 - (\Sigma x' i)^2) / N)$$

符号Nは発光点の個数(ここでは、N=4)であり、x'i、y'iは各発光点のX方向、Y方向の位置であり、i=1からNである。

次に、このようにして求められた角度 θ に基づいて、マイクロメータを手動操作して、ベース部材30を角度 θ だけ回動させ、副走査方向Q2に配列方向Q4が一致するように調整する。

[0063]

次に、回転中心に対してコリメートレンズ33の光軸を一致させるためにコリメートレンズ33の×方向位置調整、y方向位置調整を行うと共に、コリメートレンズ33のz方向位置(光軸方向位置)の調整を行う。このコリメートレンズ33の光軸方向位置調整は各発光点45a~45dをコリメートレンズ33の焦点位置(焦点面)に合わせて、コリメート性を高めるために行うものである。これらの位置調整は既述の3軸移動ステージを用いて行う。

[0064]

このコリメートレンズ33の位置調整は、各発光点45a~45dごとに行ってその最適位置を求め、この最適位置の平均値を代表特性として用いるものであり、コリメートレンズ33はその平均値に位置される。

[0065]

このコリメートレンズ33の位置調整後、図示を略す紫外線照射装置により、 紫外線(UV光)をコリメートレンズ33の上方から照射してコリメートレンズ 33を透過した紫外線により紫外線硬化型樹脂を硬化させ、コリメートレンズ3 3を円弧状支持部34に接着固定する。次に、コリメートレンズ把持アームによ るコリメートレンズ33の把持を解除して、ビームスポット52~55の配列状 態、すなわち、ビームスポット52~55の主走査方向Q1の間隔y2~y4が 規格σ内にあるか否かを測定する。

[0066]

ビームスポット52~55の主走査方向Q1の間隔 y2~ y4が規格 σ外である場合、すなわち、ビームスポットの配列状態が適正でない場合には、再度ベース部材30の角度調整を行うと共にコリメートレンズ33の位置調整を行う。この調整作業終了後、スプリングワッシャ付きのネジ47、47を増し締めし、ベース部材30を取り付けブラケット20に回動不能に固定する。そして、各レーザビームの光学特性、配列状態を計測し、マルチビームレーザダイオード31を消灯し、調整作業を終了する。

[0067]

これらの調整作業によって、図18に示すように、ビームスポット52~55 が実質的に副走査方向Q2に一直線に並び、画像記録面4a上での書き込み開始 位置が揃えられることになる。このものによれば、ビームスポット52~55の 書き込み開始位置が揃えられるので、画像形成装置本体部の制御回路、駆動回路 の構成の簡単化を図ることができる。

[0068]

すなわち、マルチビーム光源ユニット組立調整工程では、マルチビームレーザダイオード31の発光点45a~45dの配列状態を測定する測定と、発光点45a~45dの配列状態の測定に基づき設計基準方向に発光点の配列方向が一致するようにマルチビームレーザダイオード31を回転調整する回転調整と、マルチビームレーザダイオード31の回転調整後にコリメートレンズ33の位置調整を行ってマルチビームレーザダイオード31に対するコリメートレンズ33の位置決めを行う位置決めとが行われる。なお、アパーチャ部材36はこの調整後に組み付けられる。

[0069]

ここでは、配列状態としての配列方向Q4を評価することとしたが、ベース部材30を所定角度毎回転させて、主走査方向Q1の間隔(偏差)y2,y3,y4をそれぞれ求め、この偏差y2,y3,y4のうちの最大偏差が最小となる角度 θ を発光点 $45a\sim45$ dの配列方向Q4とみなして、これによって、この方

向にマルチビームレーザダイオード31を回転調整して、ビームスポット52~ 55の書き込み開始位置を揃える構成とすることもできる。

[画像形成装置本体部の概略構成]

図19、図20は画像形成装置本体部のハウジングの概略構成を示し、図19は光源ユニット19をハウジング56に取り付ける前の状態を示し、図20は光源ユニット19をハウジング56に取り付けた状態を示す。

[00.70]

このハウジング56には走査光学系57が搭載されている。その走査光学系57はポリゴンミラー58とfθレンズ59とから概略構成されている。そのハウジング56の底壁には位置決め基準部60が設けられている。この位置決め基準部60には一対の位置決めピン61、61と一対のネジ孔62、62とが図19に示すように形成されている。光源ユニット19は図20に示すようにその位置決め基準部24の基準面が位置決め基準部60の基準面に突き合わされ、かつ、位置決めピン61、61により位置決めされて、ネジ63により位置決め基準部60に固定される。

[0071]

そのハウジング56の一側壁には主走査方向Q1に沿う方向に延びる開口64が形成され、マルチビームレーザダイオード31を駆動して同時に各発光点45 a~45dを発光させると、マルチレーザビームがポリゴンミラー58により主走査方向Q1に偏向されてf0レンズ59、開口64を透過して記録媒体としての感光体ドラム65の感光面65aに照射され、その感光面65aに4個のビームスポット11が形成される。この4個のビームスポット11は、マルチビームレーザダイオード31の各発光点45a~45dが副走査方向Q2に調整されているので、感光面65a上で副走査方向Q2に実質的に揃っている。

[マルチビーム光源ユニットの調整装置の詳細説明]

図21はその調整装置の光学系を模式的に示している。ここで、fcoはコリメートレンズ33の後側焦点距離、fco'はコリメートレンズ33の前側焦点距離、f1'は集光レンズ48の前側焦点距離、f1'は集光レンズ48の後側焦点距離である。撮像素子49の撮像面(エリア型受像面)49aは集光レンズ4

8の後側焦点距離 f 1 に位置されている。その集光レンズ4 8 の前側焦点位置は コリメートレンズ3 3 の後側焦点位置に実質的に一致されている。

[0072]

このように、光学系を配置すると、マルチビームレーザダイオード31の各発 光点45a~45dから出射されたマルチビームレーザはコリメートレンズ33 によって実質的に平行光束に変換され、全ての発光点45a~45dから出射さ れた各レーザビームが集光レンズ48によって撮像面49aに実質的に拡大して 集光結像される。従って、各ビームスポットの位置を高精度で測定することが可 能となる。

[0073]

図22はその撮像面49aに形成されたビームスポット52の拡大図を示している。その各ビームスポットの位置は重心位置を演算することによって求められる。そのビームスポット11の重心位置の演算の一例を以下に説明する。

[0074]

撮像面49aの各画素を符号Zijによって定義する。Z1j、Z2j、…、Zij、…、Znjは主走査方向Q1に配列された画素を意味し、Zi1、Zi2、…、Zij、…、Zimは副走査方向Q2に配列された画素を意味し、符号i(1からnまでの整数)は左側から数えてi番目を意味し、符号j(1からmまでの整数)は下から数えてj番目であることを意味している。

[0075]

そこで、主走査方向Q1に配列されている各画素Z1j、Z2j、…、Zijから出力された出力信号の総和Wj(Wj=Z1j+Z2j+…+Zij+…+Znj)を副走査方向Q2についてj=1からj=mまで順次求めると、副走査方向Q2のレーザビーム強度分布曲線B1を求めることができる。また、副走査方向Q2に配列されている各画素Zi1、Zi2、…、Zij、…、Zimから出力された出力信号の総和Wi(Wi=Zi1+Zi2+…+Zij+…+Zim)を主走査方向Q1についてi=1からi=nまで順次求めると、主走査方向Q1の光ビーム強度分布曲線B2を求めることができる。

[0076]

図23はこのビーム強度分布曲線B2に対して閾値P1hを設定し、この閾値P1hを横切る強度に対応する主走査方向Q1の画素の番地X1、X2を特定し、この番地X1と番地X2との和の平均値に相当する画素の番地Ximを求める。これにより、ビームスポット11の主走査方向の重心位置(中心位置)O1が求められる。同様の処理をビーム強度分布曲線B1について行うことにより、副走査方向の重心位置(中心位置)が求められる。なお、その閾値P1hはピークPmaxからe(自然対数)の2乗分の1のところに設定する。

[0077]

このように、撮像面49aに結像されたビームスポット11の全体のビーム形状に基づいて、その重心位置を演算しているので、その演算精度を高めるために、撮像面49a上での各ビームスポットの結像面積が画素の面積の十倍以上となるように光学系を構成することが望ましい。

[0078]

すなわち、図24に示すように、撮像面49 a上でのビームスポットの主走査方向のビーム径をWm、撮像面49 a上でのビームスポット11の副走査方向のビーム径をWs、スリット開口36 aを通過後のレーザビームの主走査方向のビーム径をDm'、同じく副走査方向のビーム径をDs'、マルチビームレーザダイオード31の発振波長を1としたとき、

 $Wm = (f 1 \times \lambda) / (\pi \times Dm')$

 $W s = (f 1 \times \lambda) / (\pi \times D s')$

の式に基づき、主走査方向、副走査方向のビーム径を演算し、

π×Wm×Ws>画素の面積×10

となるように調整装置の光学系を設計する。

[0079]

また、最も離れた発光点45aと発光点45dとの主走査方向のピッチずれ量をPLDAm、発光点45aと発光点45dとの副走査方向のピッチずれ量をPLDAs、撮像面49a上での発光点45aのビームスポット52と発光点45dのビームスポット55との主走査方向のピッチをPccdm、撮像面49a上での発光点45aのビームスポット55と

の副走査方向のピッチをPccdsとし、Pccdm=(f1/fco)×PLDAm、Pccds=(f1/fco)×PLDAsの式に基づき、ピッチずれ量を演算して、発光点45aのビームスポット52と発光点45dのビームスポット55とが撮像面49aからはみでないように、以下の関係式を満足するように、光学系の倍率を設定する。

 $Pccdm \times (N-1) + Wm < Lm$

 $Pccds \times (N-1) + Ws < Ls$

ここで、Lmは横方向(主走査方向)の撮像面49aの全長、Lsは縦方向(副走査方向)の撮像面49aの全長、Nは発光点の個数であり、ここでは、N=4である。

[0080]

このように光学系の倍率を設定すると、1個の撮像素子49で4個の発光点45a~45dの評価を同時に行うことができることになり、効率的である。

[0081]

また、発光点45a~45dを同時に点灯させる場合、各発光点45a~45dの発光出力が実質的に等しくなるように以下に説明する制御を行う。まず、各発光点45a~45dの任意の1個を点灯させて、その点灯された発光点に基づく撮像素子49の出力を検出して基準出力P1として記憶する。

[0082]

次に、そのすでに点灯されている発光点をそのままの状態として、残りの発光点のうちの1個を点灯させて撮像素子49の出力がその基準出力P1の2倍となるようにレーザ駆動制御回路を調整する。この制御調整を4個の発光点45a~45dについて順次行い、基準出力P1の4倍となるように、レーザ駆動制御回路を調整する。一般に、N個の発光点がある場合には、図25に示すように基準出力P1のN倍となるようにレーザ駆動制御回路を設定する。

【0083】

このようにレーザ駆動制御回路を設定すれば、撮像面49 a 上での各ビームスポットの強度を一定にすることができ、その各ビームスポット52~55の位置の評価を正確に行うことができることになる。

[マルチビーム光源ユニット及びその調整方法の発明の実施の形態2]

図26~図28はマルチビーム光源ユニット19の発明の実施の形態2を示し、発明の実施の形態1において説明したビーム光源ユニット19と同一構成要素については同一符号を付して、その詳細な説明を省略し、異なる部分についてのみ説明する。

[0084]

ここでは、ベース部材30そのものの下面に位置決め基準部30aが設けられている。押圧板40には被把持部40dが設けられている。また、押圧板40aの貫通孔40c、40cはネジ43の軸部よりも若干大きな径とされている。マルチビームレーザダイオード31はその円筒状本体部31Aを嵌合孔42に嵌合させると共にステム31Bを取り付け基準孔42aに嵌合させて、突き当て基準面42bに押し当てる。

[0085]

次に、そのステム31Bの切り欠き47が係合片40bに係合するようにして 押圧板40の押圧バネ片40aをステム31Bの背面に押し当て、ネジ43によ りマルチビームレーザダイオード31のステム31Bをベース部材30の突き当 て基準面42bに押し付ける。その押し付け力はマルチビームレーザダイオード 31が嵌合孔42に対して回転可能な程度の大きさとする。そのベース部材30 は調整装置の位置決め基準部材66にセットされる。

[0086]

この位置決め基準部材66は位置決め基準面66a、66bを有する。位置決め基準面66aにはベース部材30の位置決め基準部30aの基準面が突き当てられ、位置決め基準面66bにはベース部材30の位置決め基準部37の基準面が突き当てられる。

[0087]

被把持部40dは上下方向に可動の移動ステージに設けられた一対の把持アーム67、67に把持される。その把持アーム67、67は上下方向に拡開可能とされ、図示を略すスプリングによって互いに接近する方向に付勢されている。その移動ステージにはマイクロメータの先端51が当接されている。ネジ43と貫

通孔40c、40cとの間には若干の遊びがあり、かつ、係合片40bが切り欠き47に係合しているので、しかも、マルチビームレーザダイオード31はベース部材30に回転可能に押し付けられている程度なので、マイクロメータを操作すると、被把持部40dの端部に加わる上下方向の力によって、マルチビームレーザダイオード31が嵌合孔42の中心軸を中心にして回転される。把持部材67、67は被把持部40dの端部を把持しており、被把持部40dから回転中心までの長さを大きくすれば、小さな力でマルチビームレーザダイオード31を回転させることができる。

[0088]

次に、円弧状支持部 34 に紫外線硬化型接着剤を塗布し、コリメートレンズ把持部材に把持されたコリメートレンズ 33 を円弧状支持部 34 の設計上予定された初期位置にセットする。次に、マルチビームレーザダイオード 31 の各発光点 $45a\sim45$ dを発光させ、初期状態でのビームスポット $52\sim55$ の位置を計測し、発光点 $45a\sim45$ d の配列状態としての配列方向の傾き角度 θ を測定する。

[0089]

その後、マルチビームレーザーダイオード31を角度θ分だけ光学系の光軸回りに回転させ、ビームスポットの配列方向Q4が副走査方向Q2に揃うように調整する。この調整手順以降は既に説明したので、その詳細な説明は省略する。

[0090]

このようにして、発光点45a~45dの配列方向を副走査方向Q2に設定後、ネジ43、43を増し締めしてマルチビームレーザダイオード31をベース部材30に固定し、設計的に予定された規格内にビームスポットが整列されているか否かを最終的に検査する。この検査結果が規格内にあれば、各発光点45a~45dを消灯させて調整作業を終了する。

[0091]

画像形成装置のハウジング56にはこのベース部材30を位置決めする位置決め基準部(図示を略す)が対応して設けられ、この位置決め基準部にベース部材30が位置決め固定される。

[0092]

以上、発明の実施の形態では、発光点45a~45dの配列方向の調整を行った後、コリメートレンズ33の位置調整を行うことにしたが、コリメートレンズ33の位置調整を行った後、発光点45a~45dの配列方向の調整を行っても良い。

[0093]

【発明の効果】

本発明のマルチビーム光源ユニットの調整方法によれば、設計基準直線に対する発光点の配列状態を画像記録面に対応する像面上でのビームスポットに基づき 測定して、光学系の光軸回りにマルチビームレーザダイオードを回転調整することにしたので、その発光点の配列方向を設計基準直線の方向に容易に揃えることができる。

[0094]

特に、各発光点の配列方向を画像形成装置本体部に取り付ける前に予め副走査方向に揃えることにすれば、画像形成装置本体部にマルチビーム光源ユニットを取り付けてから副走査方向のビームスポットのピッチを調整するという調整操作、ビームスポットのピッチ調整により主走査方向にずれた書き込み開始位置を補償するために、画像形成装置本体部に各レーザビームの走査位置を検出する検出センサを各レーザービーム毎に設けて、各レーザビーム毎に書き込み開始位置を制御するという複雑な構成、各レーザビームの主走査方向の時間的遅延を測定して遅延回路によりレーザビームの駆動制御を行うという複雑な構成を避けることができ、部品点数の低減、画像形成装置本体部への取り付けに要する組立時間の短縮、低コスト化を図ることができる。また、ソフトウエアによる制御の簡単化も図ることができる。

[0095]

本発明のマルチビーム光源ユニットの調整装置によれば、全ての発光点からの マルチレーザビームを拡大してかつ極力集光して実質上撮像面に集光結像させる ことができるので、ビームスポットの位置を高精度に検出できる。

[0096]

本発明のマルチビーム光源ユニットの組立方法によれば、マルチビーム光源ユニットの組立工程において、ビームスポットの配列方向の調整とコリメートレンズの位置調整とを一緒に行うことができ、光源ユニットの組立作業の効率化を図ることができる。

[0097]

本発明の画像形成装置によれば、調整済みのマルチビーム光源ユニットを画像形成装置本体部に取り付ける際に、走査光学系に対する位置調整作業の簡略化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 走査光学系の概略構成を示す模式図である。
- 【図2】 画像記録面上でのビームスポットの配列状態を示す模式図である。
- 【図3】 マルチビームレーザダイオードの発光点の配列状態を説明するための 模式図である。
- 【図4】 画像記録面上での書き込み開始位置の制御の一例を説明するための説明図である。
- 【図5】 画像記録面上での書き込み開始位置の制御の他の例を説明するための説明図であり、(a)はビームスポットの配列方向と書き込み開始位置との関係を示す図であり、(b)はその発光点の発光タイミングを説明するためのタイミング図である。
- 【図6】 マルチビームレーザダイオードの発光点の配列方向と設計基準方向との傾きを説明するための図である。
- 【図7】 本発明の実施の形態1に係わるビーム光源ユニットの分解斜視図である。
- 【図8】 図7に示す取り付けブラケットの正面図である。
- 【図9】 図7に示す取り付けブラケットの背面図である。
- 【図10】 図7に示す取り付けブラケットの平面図である。
- 【図11】 図7に示す光源ユニットを正面側から目視したときの要部拡大図である。
- 【図12】 図7に示す光源ユニットを背面側から目視したときの要部拡大図で

ある。

- 【図13】 図7に示すマルチビームレーザダイオードの拡大平面図である。
- 【図14】 図7に示す光源ユニットの背面図である。
- 【図15】 図7に示す光源ユニットの正面図である。
- 【図16】 図7に示す光源ユニットの調整装置の概略図である。
- 【図17】 図7に示す撮像面に結像されたビームスポットの配列状態を示す説明図である。
- 【図18】 図16に示す調整装置によって調整されたビームスポットの配列状態を示す説明図である。
- 【図19】 図7に示す光源ユニットが取り付けられる画像形成装置本体部の概略構成を示す斜視図である。
- 【図20】 図7に示す光源ユニットが取り付けられた画像形成装置本体部の概略構成を示す斜視図である。
- 【図21】 図16に示す調整装置の光学系の模式図である。
- 【図22】 図16に示す撮像面に形成されたビームスポットの一例を示す模式 図である。
- 【図23】 図22に示すレーザビーム分布曲線から重心位置を求めるための一例を示す説明図である。
- 【図24】 ビームスポットと撮像面の大きさとの関係を説明するための模式図である。
- 【図25】 各発光点の出力を揃えるための一例をグラフ化して示した図である
- 【図26】 本発明の実施の形態2に係わるビーム光源ユニットを正面側から目視した分解斜視図である。
- 【図27】 本発明の実施の形態2に係わるビーム光源ユニットを背面側から目視した分解斜視図である。
- 【図28】 本発明の実施の形態2に係わるビーム光源ユニットの調整方法の一例を示す背面図である。

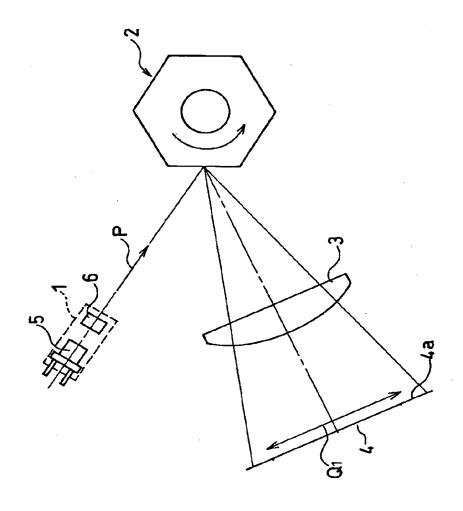
【符号の説明】

特平11-349145

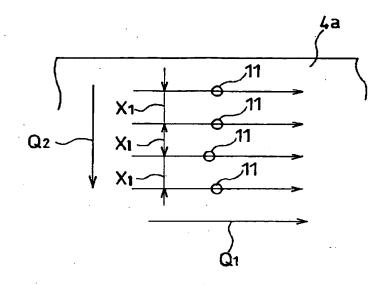
- 31 マルチビームレーザダイオード
- 318 ステム
- 33 コリメートレンズ
- 46 切り欠き

【書類名】 図面

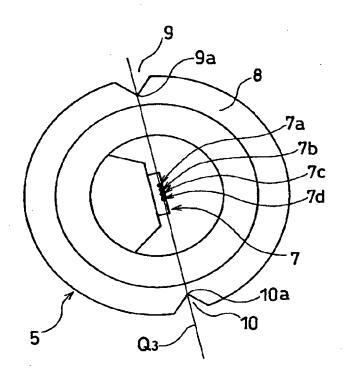
【図1】



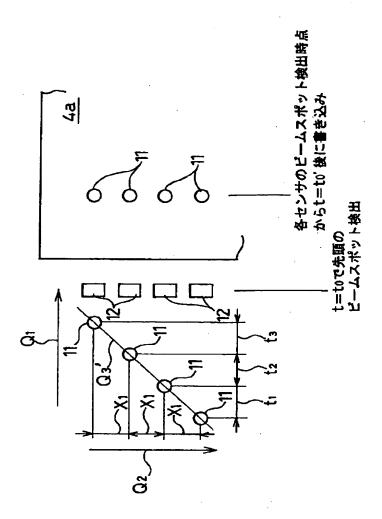
【図2】



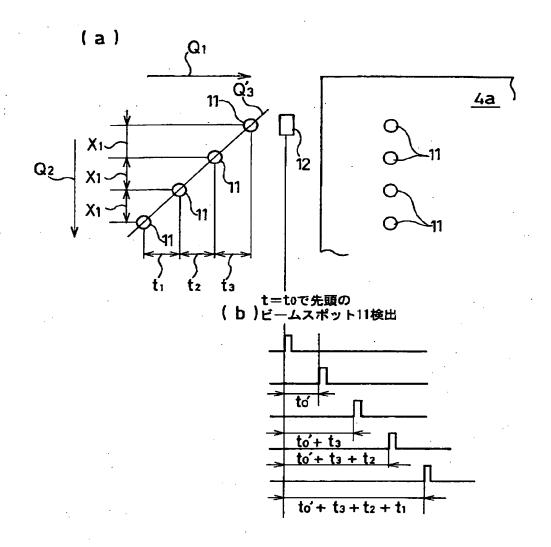
【図3】



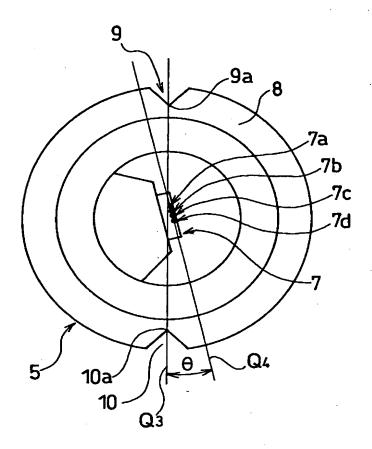
【図4】



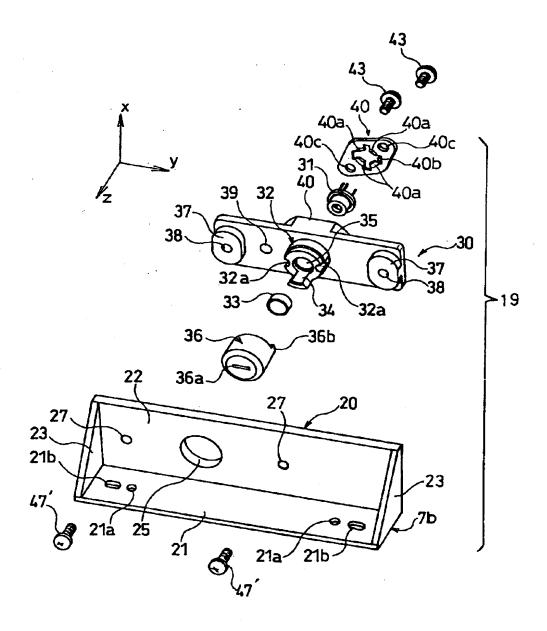
【図5】



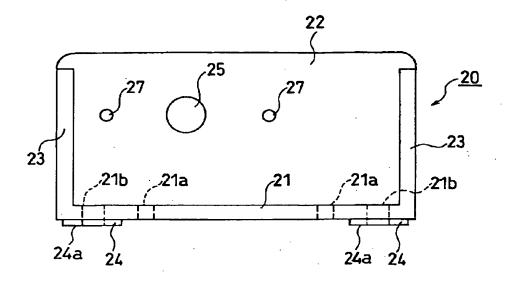
【図6】



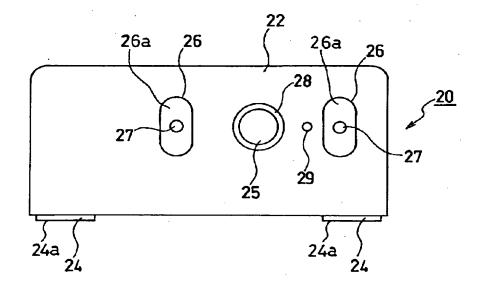
【図7】



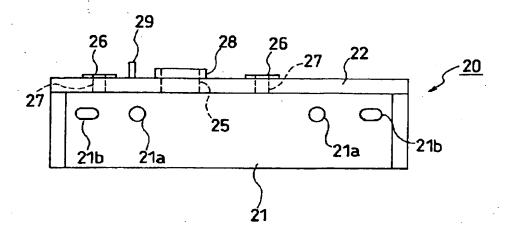
【図8】



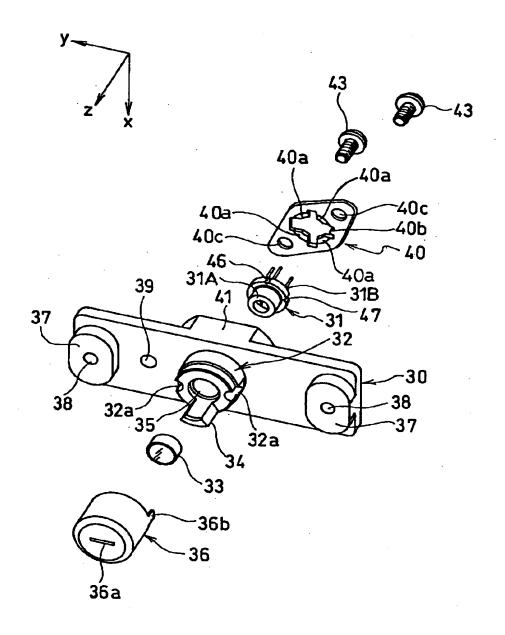
【図9】



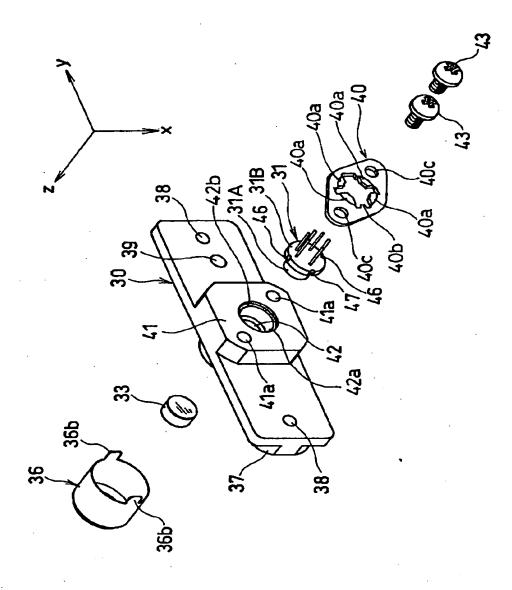
【図10】



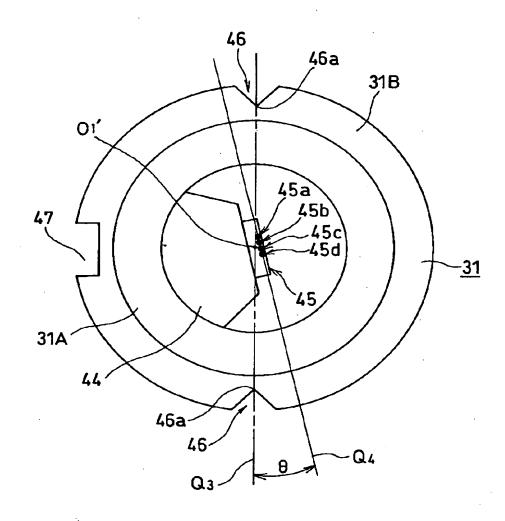
【図11】



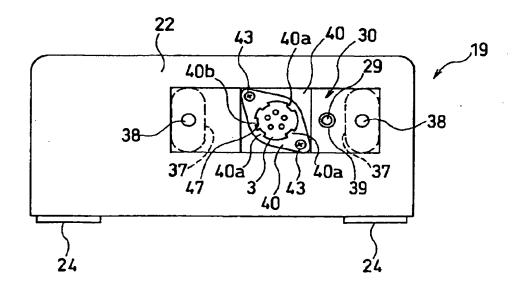
【図12】



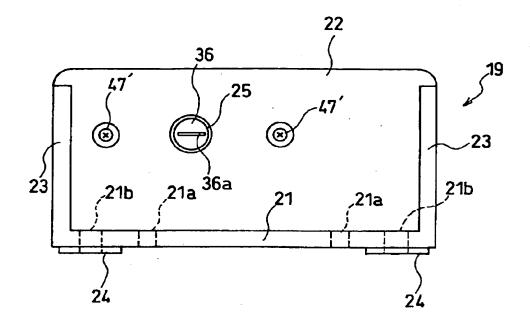
【図13】



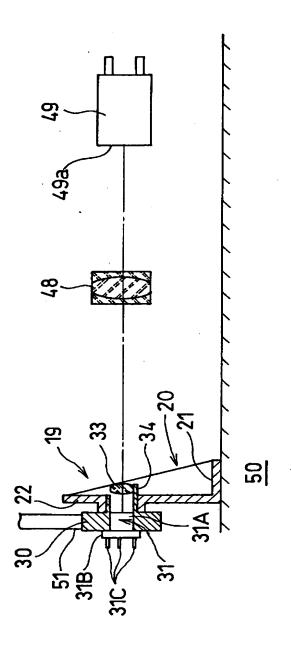
【図14】



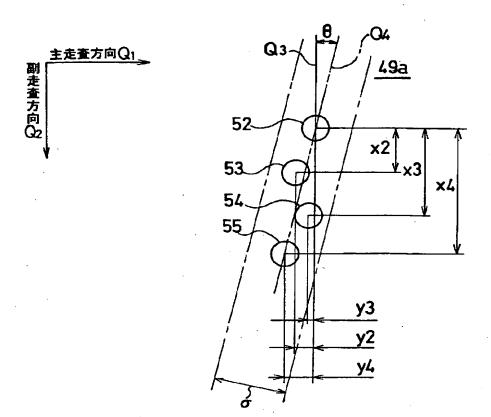
【図15】



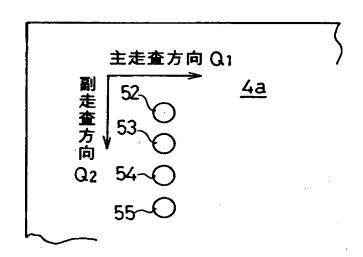
【図16】



【図17】

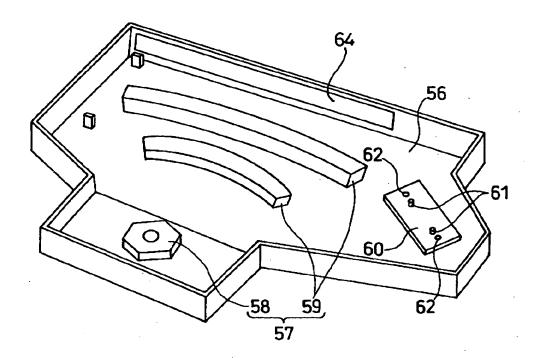


【図18】

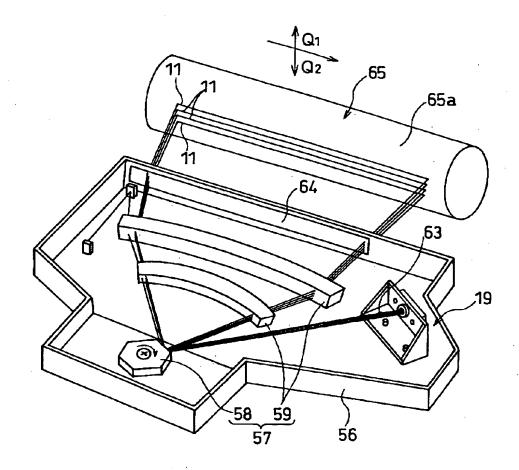


1 4

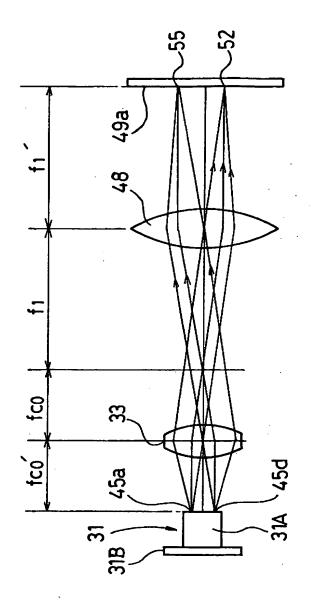
【図19】



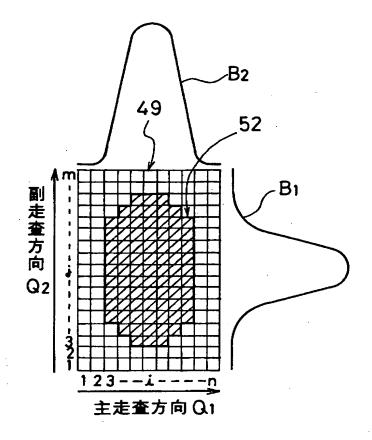
【図20】



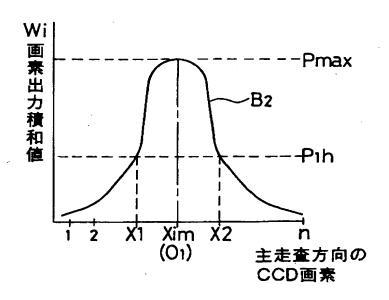
【図21】



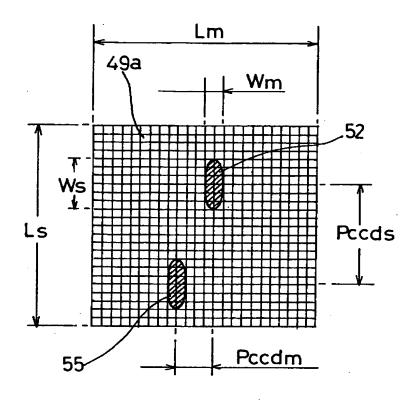
【図22】



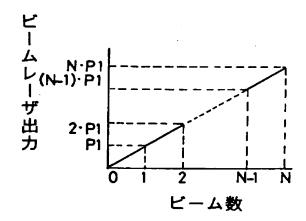
【図23】



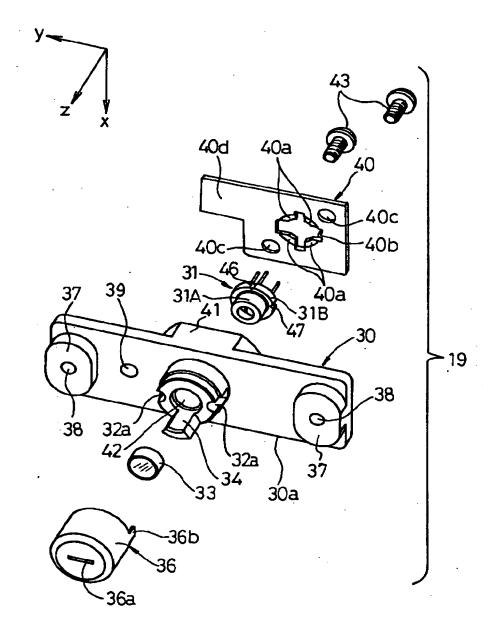
【図24】



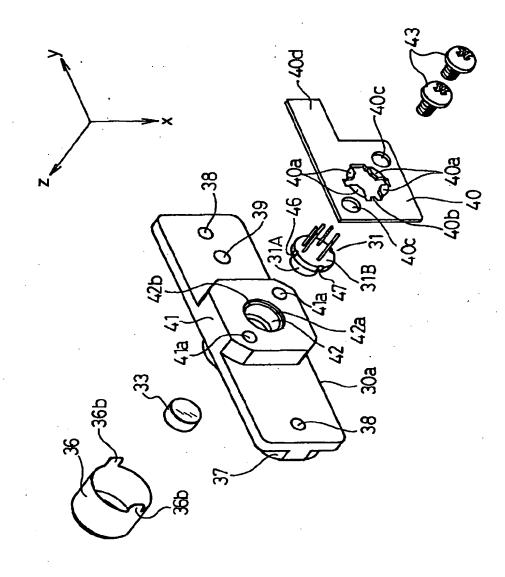
【図25】



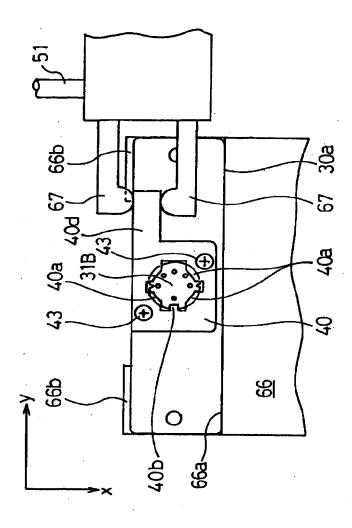
【図26】



【図27】



【図28】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 走査光学系の主走査方向に対するマルチビームレーザダイオードの発 光点の配列方向を設計的に予定された設計基準直線方向に揃えることのできるマ ルチビーム光源ユニットの調整方法を提供する。

【解決手段】 切り欠き46が形成されたステム31Bを有しかつ複数の発光点からマルチレーザビームを出射可能なマルチビームレーザダイオード31とマルチビームレーザ31を平行光束に変換するコリメートレンズ33とを備え、切り欠き46により規定される仮想直線上に発光点が存在しているときに設計的に予定された設計基準直線の方向に発光点が配列されているとして走査光学系にセットされるように設計されたマルチビーム光源ユニットの調整方法であって、

設計基準直線に対する発光点の配列状態を画像記録面に対応する像面上でのビームスポットに基づき測定して、光学系の光軸回りにマルチビームレーザダイオード31を回転調整することにより、発光点の配列方向を前記設計基準直線の方向に揃える。

【選択図】 図11

出願人履歴情報

識別番号

[000006747]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

氏 名

株式会社リコー